

ADVANCE RIKO

ZEM-5系列塞贝克系数/电阻测量系统

ZEM-5 series

新款

测试各种热电材料性能



◆ 简介

我们已经开发了“塞贝克系数电阻测量系统ZEM-3 系列”。随着热电材料的发展人们对评价热电材料的性能有了更高的要求。ZEM-5塞贝克系数电阻测量系统可用于测量高温，高电阻及薄膜等热电材料的特性。

◆ 特点

1. 应用于各种材料的特性及特殊规格的薄膜等；
2. 测试Si系列(SiGe, MgSi). (HT 型) 的材料的最佳温度传感器是使用C型热电偶；
3. 标配V-I图自检测系统；
4. 最高测试温度1200℃ (HT 型)；
5. 最大测量电阻10MΩ (HR 型)；
6. 测量在衬底上的热电沉积膜 (TF 型)；
7. 温控范围在-150℃~200℃ (LT 型)；

凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司

◆ 设备参数

型号	ZEM-5HT	ZEM-5HR	ZEM-5LT	ZEM-5TF
特点	高温	高电阻	中低温	薄膜
温度范围	100~1200℃	50~800℃	-150~200℃	50~500℃
工作气氛	低压 He 气			
试样尺寸	Square 2-4 mm or ϕ 2-4 mm \times 3-15 mm L			基质沉积: 2-4 mm W \times 0.4-1.2 mm t \times 20 mm L 薄膜厚度: 纳米级或更厚
热电偶类型	C	R	K	R
测量精度	塞贝克系数: $\pm 7\%$; 电阻: $\pm 7\%$; (不适用长度低于 5mm 长的试样)			

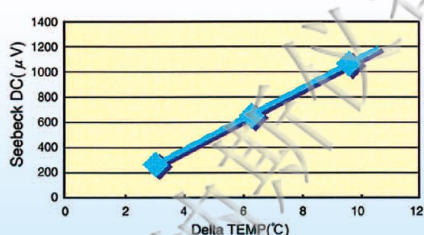
◆ 系统组成

1. 样品测量、控制、测量组件 1套
2. 数据采集 1套
3. 工作气氛控制系统 1套

◆ 安装要求

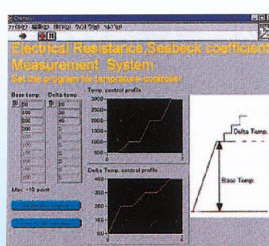
1. 电源要求 主体设备: 交流, 200V、40A 单相
PC: 交流100V, 10A
2. 水冷要求 压力: 0.15MPa; 流速: 5L/min;
3. 工作气氛 低压He; 0.2MPa
4. 安装面积 接近750mm宽 \times 900mm长

◆ Seebeck系数测试方法

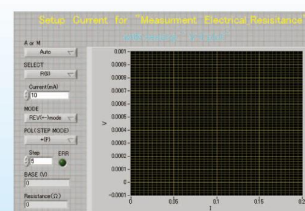


在同一炉温下测试3组不同温差Delta T,减少暗电势的影响

◆ 软件界面



温度设置界面



V/I 测试界面

更多详情, 欢迎来电咨询;

凯戈纳斯仪器商贸(上海)有限公司

地址: 上海市虹口区四平路775弄1号天宝华庭1115室

Tel: 021-5836 2582 传真: 021-5836 2581

网址: www.k-analys.se

ADVANCE RIKO, Inc.: advance-riko.com/en/